PAT-NO:

JP361074356A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 61074356 A

TITLE:

SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE:

April 16, 1986

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MIZUMOTO, HIROYUKI

USAMI, MITSUO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

HITACHI COMPUT ENG CORP LTD

HITACHI LTD

COUNTRY

N/A

N/A

APPL-NO:

JP59194728

APPL-DATE:

September 19, 1984

INT-CL (IPC): H01L023/34

US-CL-CURRENT: 257/714, 257/718 , 257/E23.09

ABSTRACT:

PURPOSE: To transmit the heat of semiconductor chips to a cooling part

efficiently by a method wherein an elastomer made of fabric cotton with

excellent thermal conductivity is laid between the cooling part and a part or

all part of junction part of semiconductor device.

CONSTITUTION: Semiconductor chips 2 are provided on specified part of a

loading substrate 1 through the intermediary of a bump electrode 3 and ten a

cooling part 5 is provided on the surface of substrate 1 through the intermediary of adhesive 6. At this time, an elastomer made of conductive

fabric cotton such as metallic yarn bundled into metallic cotton at

random may

be laid between junction part of the base 11 of cooling pat 5 and the semiconductor chips 2.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO&Japio

19日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-74356

@Int.Cl.4

砂出

願

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986) 4月16日

H 01 L 23/34

6616-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

図発明の名称 半導体装置

②特 顋 昭59-194728

②出 願 昭59(1984)9月19日

の発 明 者 水 本 裕 之 **察野市堀山下1番地 日立コンピュー**タエンジニアリング

株式会社内 の発 明 者 字 佐 美 光 雄 小平市上水本

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所デバイス開

発センタ内

秦野市堀山下1番地

⑪出 願 人 日立コンピュータエン

ジニアリング株式会社 株式会社日立製作所

20代 理 人 弁理士 高橋 明夫

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

外1名

明和杏

発明の名称 半導体装置 特許請求の範囲

1. 一つ又は複数の半導体チップを塔載した塔載 用基板と、冷却部を有する半導体装置において、 前記冷却部と半導体チップ又は半導体装置との接 合部の一部又は全部に熱伝導率の良い繊維状綿か らなる弾性体を介在したことを特徴とする半導体 装置。

2. 一つ又は複数の半導体チップを掲載した塔銭 用基板と、冷却部を有する半導体装置において、 前記一つ又は複数の半導体チップを塔載した塔載 用基板と前記冷却部との接合部の一部又は全部に 熱伝導率の良い繊維状綿からなる弾性体を介在し たことを特徴とする半導体装置。

3. 前記熱伝導率の良い繊維状態からなる弾性体 として金属綿を用いたことを特徴とする特許請求 の範囲第2項記載の半導体装置。

発明の詳細な説明

(技術分野)

本発明は、半導体装置に係り、特に、半導体装置の冷却技術に適用して有効な技術に関するものである。

〔背景技術〕

半導体製器は、半導体回路の密度を高めるため に、複数の半導体チップを塔戴用基板に塔載する 高密度実装技術を採用する傾向にある。

しかしながら、このような半導体装置では、半 導体チップの発生する熱が半導体回路の電気特性 に影響を与えないように、半導体チップの冷却手 段を必要とする。

そこで、接触不良を防止する球状部を有するピストンを半導体チップに接触させ、 数半導体チップの発生する熱をピストン等を介して冷却媒体に 放出する冷却技術が知られている。 (日経マグロウヒル社発行、「日経エレクトロニクス」、 1982年7月19日号、 P233~ P252の記載を参照)また、セラミックのリードレス・チップキャリ

ヤをフレキシブル基板に直接ハンダ付けし、 基板 の上下を放熟板で挟んで固定する。この固定の際 に放然板とチップキャリヤとの間に円鑓バネを使用してチップキャリヤをしっかりと固定するとともに放熱効率を良くする冷却技術も知られている。(日経マグロウヒル社発行、「日経エレクトロニクス」、1984年6月4日号、P214~P215の記載を参照)

しかしながら、かかる技術における検討の結果、 発明者は、前者の場合、半導体チップとピストン の球状部とが点で接触されているので、充分な冷 却効率を得ることができないという問題点を見い 出した。

また、後者の場合、フリップ・チップ型半導体 装置等の突起電極を有する半導体装置にこの冷却 技術を適用すると、突起電極の強度との関係で円 錐パネの圧縮力の調整又は選択が難かしいという 間類点を見い出した。

(発明の目的)

本発明の目的は、半導体装置の冷却効率を向上することが可能な技術を提供することにある。本発明の他の目的は、半導体チップ又は半導体装置

なお、全図において、同一の機能を有するもの は同一の符号を付け、その繰り返しの説明は省略 する。

〔実施例〔〕

第1回は、本発明の実施例 Lの半導体装置の概略的な外級斜視図、第2回は、第1回の II — II 切断線における断面図である。

第1回及び第2回において、1は塔載用基板であり、主として、複数の半導体チップを烙載するためのものである。2は半導体チップであり、塔裁用基板1の所定部に突起電極3を介して設けられている。この半導体チップ2は、論理機能,記憶機能等を有しており、半導体装置の機能を構成するためのものである。

4はリードピンであり、塔戴用基板1の下部に 複数配位して設けられている。このリードピン4 は、塔戴用基板1の接続孔とその上部に設けられ た配線(図示していない)とを介して、半導体チ ップ2と外部機器とを接続するためのものである。

5は冷却部であり、對止用キャップの役目をす

を簡単な構造で容易に固定することができる技術 を提供することにある。

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明報符の記述及び部付図面によって明ら かになるであろう。

(発明の概要)

本航において開示される発明のうち、代表的なものの概要を説明すれば、下記のとおりである。

以下、本発明の構成について、実施例とともに説明する。

るために接着用6を介して特裁用基板1の上部に設けられている。この冷却部5は、その内部に透度なキャビティフを有しており、冷却媒体が流通するようになっている。このキャビティフの一個面部に冷却媒体排出口9が設けられている。この高知媒体排出口9が設けられている。この冷却媒体排出口9から半導体装置外部に排出されるようになっている。

10は熱伝導率の良い繊維状態からなる弾性体であり、例えば金属組線をランダムに東ねた金属線を用いる。この弾性体10は、冷却部5の底面11と、半導体チップ2の突起電極3と反対側の面との接合部に、その接合部の一部又は全部に介在されている。

なお、前記接着利6だけでは、基板1と冷却部5との接着部の適正な機械的強度が得られない時は、第2回に示すように、所定個所にスペーサ12を介在させて止め金具13で基板1と冷却部5を固定する。スペーサ12の厚さは、半導体チッ

ブ2に所定以上の力が加わらないようにする程度 の瓜さになっている。

また、第3回に示すように、前記冷却部5のキャピティ7内に仕切部材14を設けて、冷却媒体を千島状に流すことにより、冷却部5の底部11に配置されている半導体チップ2の全部に一様の冷却媒体が供給されるようにすることもできる。

前述の説明からわかるように、本実施例1によれば、冷却部の底面部11半導体チップ2の突起電極3と反対側の面との接合部に、熱伝導率の良い機能がからなる弾性体10をその接合部の一部又は全部に介在させることにより、半導体チップ2と底面部11との接合精度をあまり高くしなくても前記弾性体10で誤差分が調整されるので、確度よく半導体チップ2を固定することができる。

また、半導体チップ2の温度上昇につれて前記接合媒体である弾性体10が熱膨吸し、半導体チップ2と底面部11との接合度が良くなり熱抵抗が小さくなるので、半導体チップ2で発生した熱は、熱伝導率の良い弾性体10を経て冷却部5へ

固定用基板19は、いずれか一方が筐体(図示していない)に固定されている。前記スペーサ20の厚さは、半導体装置15に所定以上に力が加わらないようにする程度の厚さになっている。

また、第5図に示すように、フレキシブル基板 16の前後端部は、外部装置(図示していない) を接続するリード4が設けられている。そのフレ キシブル基板16の左右両盤部は、冷却部5の下 盤部で支持されている。

また、第6図に示すように、前記各々の半導体 装置15は、冷却部5の底面部11の凹部に埋め 込まれてスプリング18で底面部11に適正な接 合圧力で圧着されているが、各々の半導体装置1 5の底面部11の凹部に埋め込まれる深さのばら つき等の誤差が生じる。この誤差を前記弾性体1 0で調整するが、フレキシブル基板16は、この 機能をカバーする。

また、前記弾性体10の熱伝導率を大きくするために、粘土状物質又は粘性の高い液体を含有させて密度を大きくしてもよい。

効率良く伝递されて放然される。

〔突旋例 []

第4回は、本発明の他の実施例IIの半導体装置の低略的な外類斜視図、第5回は、第4回のVーV切断線における断面図、第6回は、第5回の一点類線で囲んだ部分Aの拡大図である。

本実施例Ⅱの半導体装置は、第4回乃至第6回に示すように、前記実施例Ⅰの半導体装置15を用い、代りにチップキャリア型半導体装置15を用い、 基板1の代りに多層配線のフレキンブル基板16 を用いたものである。

すなわち、冷却部5の底面部11に凹部を形成し、この凹部に弾性体10を入れ、次にフレキンブル拡板16に 中球 はされた 半導体装置15に 当でて、込んで、ピストン17を 半導体装置15に 当でて、これをスプリング18で 押圧する。スプリング18は スプリング固定用 拡板19で 支持されて スプリング固定用 抜板19は、冷却部5に スプリング 固定されている。また、冷却部5とスプリング

また、スプリング固定用基板19は、冷却部5に固定され、これと冷却部5の底面部11とが半導体数回を挟み込んでいる。したがって、スプリング固定用基板19を取りはずすことにより、半導体数配はフレキシブル基板単位で簡単に着脱できるようになついる。図中15Aは半導体数置のフレームリードである。

前述のことからわかるように、本実施例IIによれば、冷却部5の底面部11と半導体装置15との接合部に、熱伝導率の良い繊維状綿からなる弾性体10をその接合部の一部又は全部に介在させることにより、半導体装置15と底面部112の接合精度をあまり高くしなくても弾性体10及びフレキシブル基板16で誤差分が調整されるので、 構成よく半導体装置15を固定することができる。

また、半導体装置15をスプリング18で冷却部5の底面部11に押圧しつけているので、半導体装置15の温度上昇につれて前記接合媒体である弾性体10が熱膨張し、半導体装置15と底面部11との接合度が良くなり熱抵抗が小さくなる

ので、半導体装置15の半導体チップで発生した 然は、熱伝導率の良い弾性体10を経て冷却部5 へ効率良く伝達されて放熟される。これにより半 導体装置の冷却効率を向上させることができる。 〔霊魚知正〕

第7回は、木発明の実施例回の半導体装置の構成を示す要部断面図である。

本実施例回の半導体装置は、第7回に示すように、複数の半導体チップ2を配線を施した塔銭用基板1にペレット付し、ボンデングワイヤ22で半導体チップ2と塔銭用基板1の配線とを電気的に接続し、キャップ23で對止されている。前記塔銭用基板1の裏面の一部又は全部に熱伝導の良い繊維状線からなる弾性体10を介在して冷却部5とを止め金具21で所定数個所固定したものである。

外部装置との電気接続用のリードピンは、図示していないが、塔載用基板1の周辺部に設けらている。

以上説明したように、本願において開示された新 規な技術によれば、以下に述べるような効果を得 ることができる。

- ・(2) 冷却部の底面部と半導体チップ又は半導体 製配との接合部に、熱伝導率の良い機能状态から なる弾性体をその接合部の一部又は全部に介在さ せることにより、半導体チップ又は半導体装置と 底面部との接合精度をあまり高くしなくても弾性 体で製差分が調整されるので、簡単な構造で特度 よく半導体チップ又は半導体装置を固定すること ができる。
- (3) 半導体チップ及び塔殻用基板を冷却部で冷却するようにすることにより、半導体チップで発生した熱を、塔戴用基板及び熱伝導率の良い機能

このような構成にすることにより、半導体チップで発化した熱を前記塔裁用基板1及び弾性体10を通して冷却部5に効率良く伝達できるので半 消体装置の冷却効率を向上させることができる。 (実施例IV)

第8図は、本発明の実施例Ⅳの半導体装配の構成を示す要部所面図である。

本実施例IVの半導体装置は、第8回に示すように、前記実施例1と実施例IDとを組合せたものであり、半導体チップ1及び塔銭用基板15を冷却部5で冷却するようにしたものである。

外部装置との電気接続用のリードピンは、図示していないが、塔載用基板1の周辺部に設けらている。

このような構造にすることにより、前記半導体チップ1又は半導体装収15で発生した熱を、塔 裁用基板1及び熱伝導率の良い機槌状綿からなる 弾性体10を通して冷却部5へさらに効率良く放 熱することができる。

(効果)

状綿からなる弾性体を通して冷却部へさらに効率 良く放熱することができるので、半導体装置の冷 却効率をさらに向上することができる。

(4) 前記熱伝導率の良い機能状態からなる弾性 体に粘土状物質又は粘性の大きい液体を含有する ことにより、前記(1)及び(2)の効果を一層 向上させることができる。

以上、本発明を前記実施例にもとずき具体的に 説明したが、本発明は、前記実施例に規定される ものではなく、その要旨を逸脱しない範囲におい て顔々変形し得ることは勿論である。

例えば、前記実施例は、本発明を複数半導体チップを財裁した塔裁用装板を有する半導体装置に適用した例について説明したが、一つの半導体チップを財政用装板を有する半導体装置に適用してもよい。

図面の簡単な説明

第1図は、本発明の実施例1の半導体数配の概略的な外観解視図、 .

第2回は、第1回のⅡ~Ⅱ切断線における断面

团.

第3図は、第1図の冷却部の他の実施例の構成 を示す平面図、

第4回は、本発明の他の実施級 II の半導体装置 の概略的な外観斜視図、

第5回は、第4回のV-V切断線における断面図、

第6図は、第5図の一点頻線で囲んだ部分Aの 拡大図、

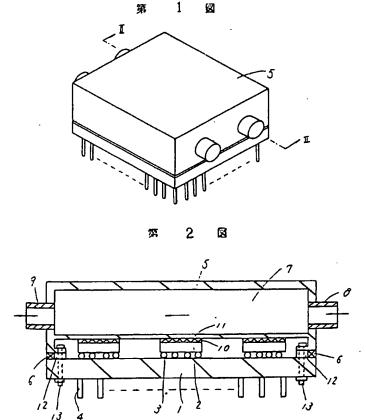
第7回は、本発明の実施例皿の半導体装置の機 成を示す要部断面図、

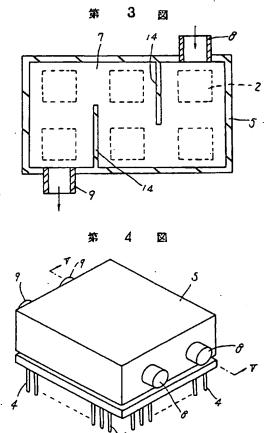
第8回は、本発明の実施例IVの半導体設配の構成を示す要部断面図である。

1… 塔戴用基板、 2 … 半導体チップ、 3 … 突起 電極、 4 … リードピン、 5 … 冷却部、 6 … 接着剤、 7 … キャピティ、 8 … 冷却媒体注入口、 9 … 冷却 媒体排出口、 1 0 … 熱伝導率の良い機雄綿からな る弾性体、 1 1 … 冷却部の底面部、 1 2 , 2 0 … スペーサ、 1 3 , 2 1 … 止め金具、 1 4 … 仕切部 材、 1 5 … 半導体装置、 1 6 … フレキンブル装板、 17…ピストン、18…スプリング、19…スプリング固定用拣板、22…ポンデングワイヤ、2 3…キャップである。

代理人 弁理士 高橋明夫

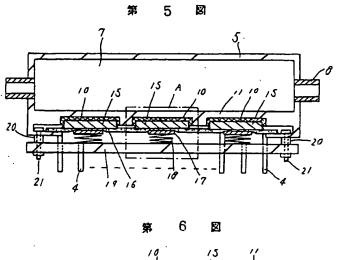


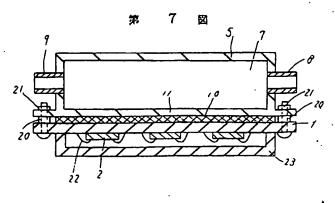


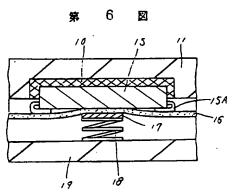


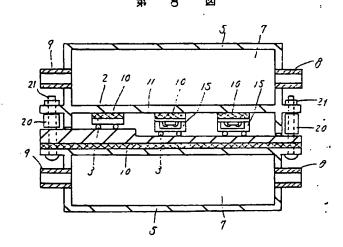
-343-

特開昭61-74356(6)









This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS .
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.